#### MANUFACTURE OF HIGH SILICON STEEL STRIP CONTINUOUS LINE

Patent number:

JP62227078

**Publication date:** 

1987-10-06

Inventor:

ABE MASAHIRO; OKADA KAZUHISA; FUKUDA SHUZO; TANAKA YASUSHI; YAMATO MASAYUKI;

TAKADA YOSHIICHI

Applicant:

NIPPON KOKAN KK

Classification:

- international:

C23C10/28; C23C16/24; C23C16/54; C23C16/56

- european: C21D8

C21D8/12F4; C23C16/24; C23C16/56; H01F1/147S1;

H01F1/147S1B

Application number: JP19860071485 19860328

Priority number(s): JP19860071485 19860328; CA19880579756 19881011

Report a data error here

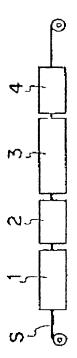
Also published as:

US5089061 (A1)

CA1323291 (A)

#### Abstract of JP62227078

PURPOSE:To obtain the titled steel material having high quality in a continuous line in a short time without deforming a steel strip or melting the edge parts by subjecting the steel strip to siliconization by chemical vapor deposition (CVD), diffusion treatment, cooling and coiling. CONSTITUTION: A steel strip S is heated to the CVD temp. or a temp. close to the CVD temp. in a heating furnace 1 without causing oxidation. The heated steel strip S is introduced into a CVD furnace 2, where it is continuously siliconized by CVD at 1,023-1,200 deg.C in an atmosphere of a nonoxidizing gas contg. 5-35mol% SiCl4. The siliconized steel strip S is subjected to diffusion treatment in an atmosphere of a nonoxidizing gas contg. no SiCl4 in a diffusion treatment furnace 3 to diffuse Si almost uniformly into the interior of the steel strip S. The steel strip S is then cooled in a cooling furnace 4 and coiled. The cooled steel strip S may be coated with an insulating film, baked and coiled as required.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-227078

(43)Date of publication of application: 06.10.1987

(51)Int.CI.

C23C 16/24

C23C 16/54 C23C 16/56

(21)Application number: 61-071485

(71)Applicant: NIPPON KOKAN KK <NKK>

(22)Date of filing:

28.03.1986

(72)Inventor: ABE MASAHIRO

OKADA KAZUHISA **FUKUDA SHUZO** TANAKA YASUSHI YAMATO MASAYUKI

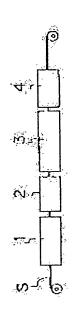
TAKADA YOSHIICHI

# (54) MANUFACTURE OF HIGH SILICON STEEL STRIP CONTINUOUS LINE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the titled steel material having high quality in a continuous line in a short time without deforming a steel strip or melting the edge parts by subjecting the steel strip to siliconization by chemical vapor deposition (CVD), diffusion treatment, cooling and coiling.

CONSTITUTION: A steel strip S is heated to the CVD temp. or a temp. close to the CVD temp. in a heating furnace 1 without causing oxidation. The heated steel strip S is introduced into a CVD furnace 2, where it is continuously siliconized by CVD at 1,023W1,200°C in an atmosphere of a nonoxidizing gas contg. 5W35mol% SiCl4. The siliconized steel strip S is subjected to diffusion treatment in an atmosphere of a nonoxidizing gas contg. no SiCI4 in a diffusion treatment furnace 3 to diffuse Si almost uniformly into the interior of the steel strip S. The steel strip S is then cooled in a cooling furnace 4 and coiled. The cooled steel strip S may be coated with an insulating film, baked and coiled as required.



#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

#### ⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

## ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-227078

@Int.Cl.⁴	識別記号	庁内整理番号		④公開	昭和62年(198	7)10月6日
C 23 C 10/28 16/24 16/54 16/56		6554-4K 6554-4K 6554-4K 6554-4K	審査請求	未請求	発明の数 2	(全 9 頁)

**9発明の名称** 連続ラインにおける高珪素鋼帯の製造方法

②特 願 昭61-71485

②出 願 昭61(1986)3月28日

正 広 横浜市港南区日野3丁目4 ②発 明者 हन 部 ⑦発 明者 B 和 久 横浜市保土ケ谷区常盤台363 出 ⑫発 明 者 福 B 脩 横浜市金沢区西柴138-46 明 蜟 横浜市港南区日野3丁目4 の発 者 田 中 横浜市保土ケ谷区常盤台363 ②発 眀 渚 大 和 正 幸 芳 川崎市多摩区生田1-19-7 眀 者 田 ⑫発 日本鋼管株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 ①出 顖 人 省三 理 弁理士 吉原 外1名 砂代

明 細 包

- 1. 発明の名称 連続ラインにおける高珪素鋼帯 の製造方法
- 2. 特許請求の範囲
- (1) 期帯を、 SiCl 4 をmol 分率で 5 ~ 35% 含んだ無酸化性ガス雰囲気中で、化学気相蒸着法により 1023~ 1200℃の温度で連続的に養珪処理し、次いで、 SiCl 4 を含まない無酸化性ガス雰囲気中で Siを鍋帯内部に略均一に拡散させる拡散処理を施し、冷却後捲取ることを特徴とする連続ラインにおける高速発網帯の製造方法。
- (2) 類帯を、 SiCl 4 をmol 分率で 5 ~ 35% 含んだ無酸化性ガス雰囲気中で、化学気相就着法により1023~1200℃の温度で連続的に適珪処理し、次いで、 SiCl 4 を含まない無酸化性ガス雰囲気中でSiを鋼帯内部に略均一に拡散させる拡散処理を施し、冷却後絶縁被膜コーティングを施し、焼付処理後捲取ることを特徴とする高珪発鋼帯の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

[ 産桑上の利用分野]

本発明は、連続ラインにおける化学気相蒸符 (以下、CVDと称す)法による高珪素鋼帯の製造方法に関する。

[従来の技術]

電磁鋼板として高速素鋼板が用いられている。 この種の鋼板はSiの含有量が増すほど鉄段が低減され、Si: 6.5%では、磁歪がOとなり、最大透磁率もピークとなる等最も優れた磁気特性を呈することが知られている。

従来、高珪素組板を製造する方法として、圧延 法、直接鋳造法及び凌珪法があるが、このうち圧 延法はSi含有量 4 %程度までは製造可能であるが、 それ以上のSi含有量では加工性が落しく悪くなる ため冷間加工は困難である。また直接鋳造法、所 コストリップキャスティングは圧延法のような加 工性の問題は生じないが、未だ開発途上の技術で あり、形状不良を起し易く、特に高珪素鋼板の製 造は困難である。

とする。

これに対し、漁珪法は低珪素綱を溶製して圧延により薄板とした後、表面からSiを設透させることにより高珪素網板を製造するもので、これによれば加工性や形状不良の問題を生じることなく高珪素鋼板を得ることができる。

[発明が解決しようとする問題点]

この後珪法は、五弓、阿部により提案され、三谷、大西らにより詳しく検討されたものであるが従来提案された方法はいずれも浸透処理時間が30分以上と長く、事実上連続ラインには適用できないという根本的な問題がある。また処理とも1230℃程度と極めて高いことから浸透処理後の薄類板の形状が極めて悪く、加えて処理温度が高過きるためエッジ部が過加熱によって溶解するおそれがあり、連続ラインでの安定通板が期待できない。

本発明はこのような従来技術の欠点を改善する ためになされたもので、後珪法を用い、連続ラインにおいて短時間でしかも高品質の高珪素鋼帯を 安定して製造することができる方法の提供を目的

#### ② センダスト合金の場合

C: 0.01 %以下、Si: 4 %以下、 A I: 3 ~ 3 %、 Ni: 4 %以下、 Mn: 2 %以下、 Cr, Ti などの耐食性を増す元素 5 %以下、 その他の不可避不純物は極力低い方が望ましい。

類帯は熱問圧延一冷間圧延により得られるものに限らず、直接鋳造・急冷凝固法により得られたものでもよい。

なお、鋼帯はCVD処理により板厚が減少する ものであり、このため最終製品板厚に対し減少板 厚分を付加した板厚のものを用いる必要がある。

本発明は、このような鋼帯にCVD法による選 珪処理-拡散処理を施すことにより高珪紫鋼帯を 得るものである。

第1図は水発明法を実施するための連続処理ラインを示すもので、1は加熱炉、2はCVD処理炉、3は拡散処理炉、4は冷却炉である。

鋼帯Sは加熱炉1でCVD処型温度またはその近傍まで無酸化加熱された後、CVD処理炉

[問題を解決するための手段]

このため本発明は拇帯を、 SiC』 4 をmo』 分率で 5~35% 含んだ無酸化性ガス雰囲気中で、化学気相蒸若法により 1023~1200℃の温度で迎続的に管理処理し、次いで、 SiC』 4 を含まない無酸化性ガス雰囲気中で Siを鋼帯内部に略均一に拡散。させる拡散処理を施し、冷却後捲取ることをその基本的特徴とする。

また本発明は、上記拡散処理一冷却後、絶縁被 膜コーティングを施し、焼付処理後捲取るように したことを他の基本的特徴とする。

以下、木発明の詳細を説明する。

本発明において、母材たる類帯(出発静鋼帯) の成分組成は、特に限定はないが、優れた磁気特性を得るため以下のように定めるのが好ましい。

① 3~ 6.5% Si-Fc 合金の場合

C: 0.01 %以下、Si: 0~ 4.0%、

Mn: 2%以下、その他不可避不純物は協力低い方が望ましい。

2に導かれ、 SiCl 4 を含む無酸化性ガス雰囲気中でCVD洗による滲珪処理が施される。

SiC』 4 を含む無酸化性ガスとは、中性或いは辺元性ガスを意味し、 SiC』 4 のキャリアガスとしてはAF, N₂ ・ He ・ H₂ ・ CH4 等を使用することができる。これらキャリアガスのうち、排がスの処理性を考慮した場合、 H₂ ・ CH4 等はHC』を発生させその処理の必要性が生じる難点がありこのような問題を生じないAF・ He ・ N₂ が迎ましく、 さらに材料の窒化を防止するという観点からすればこれらのうちでも特にAF, He が最も好ましい。

CVD処理における鋼帯表面の主反応は、 2FeC/1, 5 Fe+ SiC1 4 → Fe3 Si+ <del>2FeC/2</del> ↑

である。 Si 1 原子が鋼帯面に蒸着して Fc 3 Si 層を形成し、 Fe 2 原子が Fc C 2 2 となり、 Fe C 2 2 の 沸点 1023で以上の温度において気体状態で鋼帯装面から放散される。したがって Si 原子鼠が 28.086、Fe 原子鼠が 55.847であることから、鋼帯は質量減少し、これに伴い板厚も減少することになる。 ち

#### 特開昭62-227078(3)

なみに、Si 3 % 鋼帯を母材とし、 C V D 処型で Si 6.5 % 鋼帯を製造すると、 関暦は 8.7% 減少し、 板厚は約 7.1% 減少する。

従来法において C V D 処理に時間がかかり過ざるのは、その C V D 処理条件に十分な検討が加えられていなかったことによるものと考えられる。 木発明苦等が検討したところでは、 C V D 処理を迅速に行うための要素には次のようなものがあることが判った。

- ① 雰囲気ガス中の SiC4 4 濃度の適正化。
- ② 処理温度の適正化。
- ③ SiCl 4 の鋼帯表面への拡散及び FeCl 2 の鋼帯表面からの放散の促進。

このため木発明ではCVD処理における雰囲気ガス中のSiä度及び処理温度を規定するものである。まず、CVD処理における無酸化性ガス雰囲気中の Sicl 4 競度をmol 分率で5~35%に規定し、このような雰囲気中で鋼帯を連続的にCVD処理する。

雰囲気中の SiCl 4 が5%未満であると期待す

断面を示すものであり、CVD処理直復のポイドはほぼ完全に消失している。これに対し第.14図はSic』、40%でCVD処理し、その後拡散処理した類帯の断面を示すもので、ポイドが層状に残留していることが判る。

C V D 処理温度は 1023~ 1200℃ の範囲とする。 C V D 処型反応は鋼帯表面における反応であるか ら、この処理温度は厳密には鋼帯表面温度である。

CVD処理による反応生成物である FeC』 2 の 排点は1023℃であり、この温度以下では FeC』 2 が類帯表面から気体状態で放散されず、頻帯表面 に被体状に付着して蒸着反応を阻害してしまう。 本発明者らが行った基礎実験の結果では、この FeC』 2 の排点を境に、単位時間当りのSiの富化 割合が著しく異なり、1023℃以下では蒸着速度が 小さいため連続プロセスへの適用は困難である。 このため処理温度の下限は1023℃とする。

一方、上限を1200℃と規定する理由は次の通り である。Fc。 Siの融点は、第 3 図に示すFe - Si状 眼図から明らかなように1250℃であるが、発明者 る Si 官化効果が得られず、また、例えば蝌帯の Si を 1.0% 富化するために 5 分以上も必要となる 等、処理に時間がかかり過ぎ、連続プロセス化することが 図 類となる。

一方、 SiCl 4 を 35% を超えて含有させても界面における反応が律速になり、それ以上の Si Cl 化効果が期待できなくなる。

またC V D 処理では、 SiCl 4 競度が高いほど所聞カーケンダールポイドと称する大きなポイドが生成し易い。このポイドは SiCl 4 競度が15%程度まではほとんど見られないが、15%をこえると生成しはじめる。しかし、 SiCl 4 競度が35%以下では、ポイドが生成してもC V D 処理に引き続き行われる拡散処理によりほぼ完全に消失させることができる。換音すれば SiCl 4 競度が35%を超えるとポイドの生成が落しく、拡散処理後でもポイドが残留してしまう。第12図は SiCl 4 20%の類節で C V D 処理した直後の類節而を示すもので、蒸発圏にはポイドがみられる。第13図はこの類帯を1200℃×20min の拡散処理した後の

等の実験によれば、1250でより低い1230で程度で処理した場合でも、鋼帯表面が部分的に溶解する。また、鋼帯エッジ部分が過加熱のため溶解するのは、鋼帯表面ではFea Si相当のSi濃度14.5%以上にSiが蒸着されているためであると推定される。これに対し処理温度が1200で以下であれば鋼帯表面は溶解は全く器められず、また、エッジの過加熱も、鋼帯中心部の平均温度を1200でとすることが可能であり、微量な溶解で済むことが実験的に確認できた。以上の電油から、CVD処理温度は1023で~1200でと規定する。

以上のようにして C V D 処理された網帯 S は、引き続き拡散炉 3 に導かれ SiC I 4 を含まない無酸化性ガス雰囲気中で拡散処理される。すなわち、C V D 処理直接では、網帯表面近くは S i 濃度が高く、中心部分では B 材 S i 濃度のままであり、これを均熱・拡散処理 し 均一 S i 濃度とする必要がある。

この拡散処理は、鋼帯表面を酸化させない為に、

#### 特開昭62-227078(4)

無酸化努皿気中で行う必要が有り、また高温で行うほど処理時間が少なくて済む。

この拡散処理は、一定温度で行ってもよいが、第3図のFc-Si状態図から判るように、拡散の進行とともに類帯表層部のSi濃度が減少しその融点が上がることから、拡散の進行に伴い類帯を溶解させない程度に徐々に昇温させる(例えば複数段階で昇温させる)ことにより、拡散を促進させることができる。例えば 6.5% Si類の場合、エッジ部の過加熱を考慮しても1400℃までの昇温が可能である。

このような拡散処理後、網帯Sは冷却炉4で冷却され、しかる後捲取られる。網帯Sは通常、常温ないし 300℃までの温間状態で捲取られる。一般に、Si含有量が多く(例えば 4.0%以上)、板厚が比較的厚い網帯は温間で捲取るのが好ましい。

CVD処型速度を調帯の連続処理を可能ならしめるまで高めるには、上述したように雰囲気ガス中の SiCl 4 濃度と処理温度の適正化を図ることが必要であるが、これに加え線帯表面への

FeC』2の類帯表面からの放散を著しく促進し、 高い蒸着速度でしかも蒸着膜の不均一化を抑えつ つCVD処理できることが判った。

このようなCVD処理性の向上は、吹付ノズルにより雰囲気ガスを鋼帯表面に吹付ける方式にが特に有効である。第4図はこのノズル吹付方式に鋼帯ので、CVD処理炉2内に鋼帯Sに面して吹付ノズル5が配置され、鋼帯るので、GCI4を含む雰囲気ガスが吹付けられる。第5図分及び(4)は、吹付ノズル5による吹付状で直ので、分に示すように鋼帯面に対して可分に、或いは向に示すように斜め方向から吹付けるに、或いは向に示すように斜め方向から吹付けることができる。

このようなノズル吹付による単位時間当りのSi富化割合は、ガスの鋼帯表面に対する衝突流速の増大に比例して大きくなるが、波速を過剰に大きくしても界面における反応棟速となるためそれ以上のSi富化効果は期待できない。一般的には、5Nm/sec 以下の流速で十分な効果が得られる。また木発明では、上記拡散処理-冷却後、鋼帯

SiCl 4 拡散と 「eCl 2 の鋼帯表面からの放散とを促進することにより C V D 処理速度をより高めることが可能となる。

そして、このような事実に基づきさらに検討を加えた結果、CVD処理炉において吹込ノズルにより雰囲気ガスを被処理材に吹付け、或いはファン等により雰囲気を強制循環させることによりSicl 4 の調帯表面への拡散及び反応生成物たる

に連続的に絶縁被膜コーティングを施し、 焼付処理後捲取るようにすることができる。 第 2 図 はこのための連続処理ラインを示すもので、 6 はコーティング装置、 7 は焼付炉である。

絶縁途料としては、無機系、有機系の適宜なものを用いることができる。無機系塗料としては、例えばリン酸マグネシウム、無水クロム酸、シリカゾル等が、また有機系塗料としてはプラスチック樹脂等が用いられる。塗料はロールコータ方式、

#### 特開昭62-227078 (5)

スプレー方式等により鋼帯Sに塗布され、無機系塗料の場合には約 800℃程度、有機系塗料の場合には 200~300 ℃程度で焼付処理する。

なお前記加熱が1では無酸化加熱が行われるものであり、このため電気間接加熱、通電加熱、 薄加熱、ラジアントチューブ間接加熱、 直火運元 加熱等の加熱方式を単独または適当に組み合せた 加熱方法が採られる。なお、 間接加熱方式を採る 場合、加熱に先立ち電気洗浄等の前処理が行われ る。前処理を含めた加熱方式として例えば次のようなものを扱用できる

- ① 前処理 (予熱) 電気間接加熱(または 誘導加熱)
- ② 前処理 (予熱) ラジアントチューブ加熱 電気間接加熱 (または誘導加熱)
- ③ (予熱) 直火選元加熱 電気間接加熱 (または誘導加熱)
- ① 前処理 (予熱) ラジアントチューブ間接加然(セラミックラジアントチューブ方式)
- ⑤ (予熱)- 直火還元加熱

処理した場合を示す。なお、Si富化割合とは、及材当初のSi設度に対するCVD処理一拡散処理後のSi馅加分を示す。

これによれば、 SiC 1 4 遺度 5 %以上、 C V D 処型温度 1023で以上において大きな Si 富 化 効果が得られている。また同じ条件でも、吹付ノズルにより雰囲気ガスを吹付ける方法の場合、単に雰囲気中で掲帯を通板せしめる場合に較べ格段に優れた Si 富化効果( C V D 処理性)が得られていることが判る。

第8図は同様のCVD処理炉-拡散処理炉を用い、雰囲気法Aとノズル吹付法Bの蒸着時間と鋼帯中Si複度(拡散処理後のSi 複度)との関係を、Si:3%、板厚 0.5mmの構帯を SiCl 4 複度 21%、処理温度 1150℃で CVD処理した場合について調べたものである。なお、ノズル吹付法では、スリットノズルにより鋼帯に対し垂直方向から 0.2Nn/sec の流速で雰囲気ガスを吹付けた。 同図から判るように、 6.5% Si 類とするために雰囲気法Aでは7分かかるのに対し、ノズル吹付法3で

また、冷却が4での冷切方式に特に限定はなくガスジェット冷加、ミスト冷加、放射冷却等の特性冷却方式を単独または組合せた形で採用することができる。

本発明は、 6.5% Si類帯のような珪素含有量が極めて高い類帯の製造に好適なものであることは以上述べた通りであるが、従来、圧延法で製造する場合に変形が多く歩削りが悪かったSi: 2~4% 程度の高珪素類帯も容易に製造できる利点がある

#### [実 施 例]

〇 実施例-1

小型のCVD処理炉-拡散処理炉を用い、CVD処理性に対する SiC1 2 濃度及びCVD処理温度の影響を調べた。その結果を第6図及び第7図に示す。

図中、Aが雰囲気法、すなわちノズル吹付を行わないでCVD処理した場合、またBがノズル吹付法、すなわち第4図に示すように雰囲気ガスを顕帯面に 0.5m/Sの流速で吹き付けつつCVD

は 1.5分で処理することができた。

第9 図はこのようにして 得られた 鋼帯の磁気特性を示すもので、 いずれの 場合も良好な結果が得られている。

第10図はノズル吹付法における衝突ガス流速と 鋼帯のSi富化割合(拡散処理後の割合)との関係 を示すものであり、所定レベルまでは衝突ガス流 速に比例して類帯のSi富化割合が増大している。

#### 〇 実施例-2

第1図に示す連続プロセスで板厚 0.35 mm、 磁幅 900mm、 Si3.5 % 含有類帯を取材とし、ラインスピード 25 mpm で Si: 6.5 % 含有類帯を製造した。なお、 C V D 処理炉で は、 吹付ノズル方式により、A r をキャリアガスとした SiCl 4 濃度 20 mol %の雰囲気ガスを、 類板に対し 0.3 N m / sec のガス流速で吹き付けた。

第 1 1 図はこの場合の熱サイクルを示すもので、 木実施例では拡散処理時に 1200℃から 1320℃の 2 段昇熱を実施した。この結果、W<sub>10/50</sub> : 0.55。 W / kg という極めて低鉄 組の良質な 6.5% Si鋼帯

#### 特開昭62-227078(6)

を製造できた。

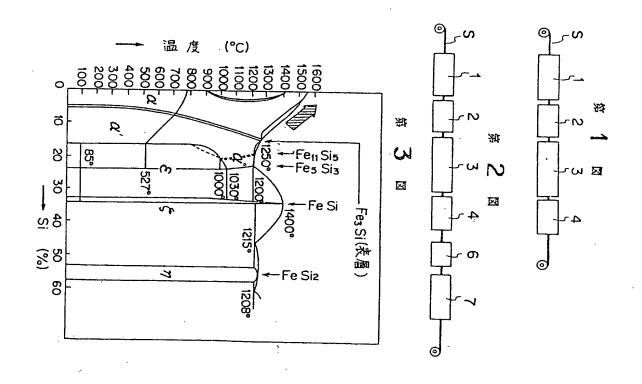
#### [発明の効果]

以上述べた木発明によれば連続ラインにおいて短時間でCVD処理を行うことができ、また1200 で以下の温度でCVD処理を行うため構帯の形状不良やエッジ部溶解等の問題を生じさせることがなく、このためラインの長大化を招くことなく高品質の高珪素類板を能率的に製造することができる。

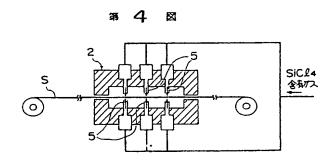
#### 4. 図面の簡単な説明

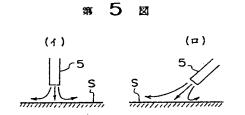
第1回及び第2回はそれぞれ本発明法を実施するための連続処理ラインを示す説明図である。第4回及び第3回はFc-Si系状態図である。第4回及び第第回のは、第4回及び第3回ので、第4回は全体説明図、第5回ので、第4回は全体説明図、第5回のである。第6回はCVD処理におけるガス中SiCluのである。第8回は本発明におけるSi流音時

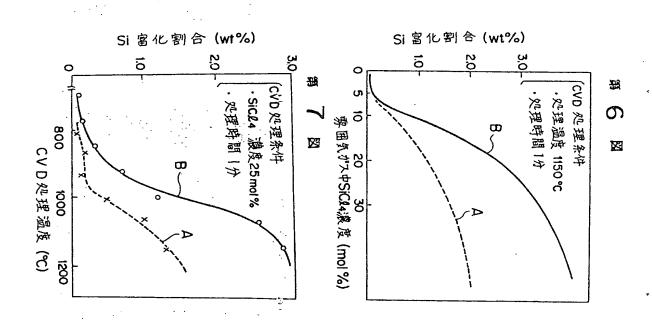
図において、1は加熱炉、2はCVD処理炉、 3は拡散処理炉、4は冷却炉、6はコーティング 装置、7は焼付炉、Sは鍋帯である。



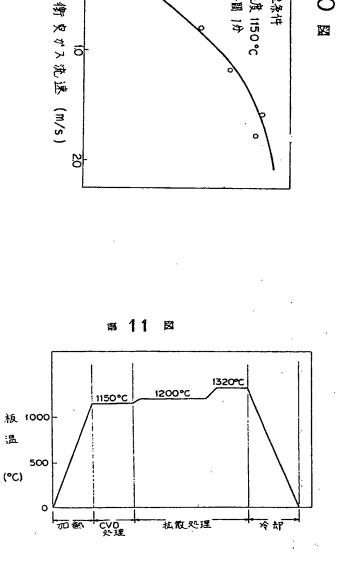
# 特開昭62-227078 (7)







# 特開昭62-227078 (8) 鋼帯中Si 濃度 (wt%) 0 0 7 0 D 4 E 窸 $\infty$ X2 最大透磁率 μm (x104) 9 X 第 12 BEST AVAILABLE COPY 处理调节



Si 富化割合 (wt%)

· 処理温度 1150°C

CVD 処理条件

0

X

ö

00

œ

<u>ი</u> ი

· 談所 (wt%)

蒸着時間(分)

## 特開昭62-227078 (9)

## 手 続 補 正 書(自発)

មាតា 6 1 ម 6 ភ 2 5 ឆ

特許庁長官 宇 贯 道 郎

RQ.

(特許疗案查官

RB)

1. 事件の表示

昭和 61 年 特 許 願第 71485 周

2. 発明の名称

連続ラインにおける高珪素解析の製造方法

3. 補正をする者

事件との関係

4 辞 人 辞 人 顧 化

(412) 日本鋼管株式会社

4. 代 理 人

処理翻章

東京都中央区製版3丁目5 新12 1) ナエグナギ的 元3(562) 4031 (RA)

(6824) 吉 原 省



5. 補正命令の日付

邢和 年 月 日

6. 補正の対象

明細背中発明の詳細な説明の欄

7. 稲正の内容 別紙のとおり

61. G.25

方式 (家)

袖 正 内 容

ÿ 14

/ 本願明細費中第16頁14行目中「SiC4」 とあるを『SiC4』と訂正する。